

# MÉTROLOGIE DES SURFACES : COFFMET SURF

Métrieologie de surface pour des décisions sécurisées et une communication inter-divisions rentable



Ref : SURF01

DISPONIBLE EN INTRA

## Présentation de la formation

### Objectifs pédagogiques

- Situer les informations dans les normes d'états de surfaces 2D et 3D
- Décomposer une spécification d'état de surface 2D ou 3D
- Apprécier et traduire des résultats de mesures
- Examiner et interpréter des profils 2D ou surfaces 3D à travers certains paramètres

### Méthodes pédagogiques

Méthode pédagogique alternant théorie, exercices en fin de module et démonstrations sur logiciels et appareils

### Compétences visées

Intégrer la métrologie des surfaces selon les normes internationales

### Moyens d'évaluation

Quiz de fin de module + examen de fin de formation

### Profil du formateur

Formateur expert dans la mesure des Etats de Surfaces, unique formateur accrédité par AUKOM pour animer cette formation en France

### Personnel concerné

Techniciens de mesure de production, ingénieurs de production, développeurs, ingénieurs concepteurs, responsables AQ

### Prérequis

Aucun prérequis technique

## SESSION EN 2026

### Senlis

⌘ 14h - 1200 € HT

→ date à venir pour cette session

## CONTACTS

### Renseignements inscription

Service Formation  
+33 (0)970 820 591  
formation@cetim.fr

### Responsable pédagogique

Kévin Chauveau

### En situation de handicap ?

Consulter notre référent handicap pour étudier la faisabilité de cette formation à  
referent.handicap@cetim.fr

## Programme de la formation

- **Fondamentaux et historique**
  - › Test de l'ongle
  - › Méthode du palpeur
  - › Surveillance de la production
- **Appareils de mesure et capteurs**
  - › Palpeurs tactiles et optiques
- **Filtres et longueurs d'onde de coupure**
  - › Introduction au filtrage
  - › Passe-haut, Passe-bas, Passe-bande
  - › Longueurs d'onde de coupure  $\lambda_c$ ,  $\lambda_s$ ,  $\lambda_f$
  - › Analyse de Fourier
  - › Analyses spécifiques, types de filtres et autres applications du filtrage numérique
- **Mesure**
  - › Choix de l'appareil de mesure
  - › Préparation de l'appareil et emplacement de la mesure
  - › Règles d'acceptation des tolérances
- **Paramètres 2D (ISO 21920)**
  - › NF EN ISO 21920 : les changements de la nouvelle norme
  - › NF EN ISO 4287 : anciens et nouveaux paramètres
- **Spécification**
  - › Spécification ISO 1302, VDA 2005 et ISO 21920- 1
  - › Délimitation des imperfections de surface
- **Étalonnage**
  - › Ajustage, qualification et étalonnage des appareils de mesure
- **Nouveautés de l'ISO21920**
  - › Motivation des nouvelles normes de profil
- **Paramètres 3D (ISO25178)**
  - › Séquence de mesure surfacique
  - › Filtrage de mesure surfacique
  - › Paramètres 3D
  - › Différence entre rugosité de profil et de surface
- **Méthode des motifs ISO12085**
  - › Conditions de mesure par la méthode des motifs et applications
- **Examen**

## Autres formations sur le même thème

- Fondamentaux du contrôle des critères de rugosité - Niveau 1 (EDS01)
- Normalisation et contrôle des critères de rugosité - niveau 2 (EDS02)
- Analyse des états de surface et des écarts de forme - niveau 3 (EDS03)
- Mesures et analyse des états de surface 3D - Niveau 4 (EDS04)

## EN PARTENARIAT AVEC



Cette formation



Même thématique